

توظيف تقنية الأشعة السينية لدراسة تأثير الأشعة المؤينة على رقائق الألمنيوم المستخدم في حفظ الأغذية

أسماء أحمد عزيز

قسم الفيزياء، كلية التربية، جامعة تكريت، تكريت، جمهورية العراق

الملخص

تم في هذا البحث دراسة تأثير الأشعة المؤينة (أشعة كاما وجسيمات ألفا) على رقائق الألمنيوم المستخدم في حفظ الأغذية بتقنية الأشعة السينية (X-rays)، من خلال دراسة معدل الشدة النافذة لرقائق الألمنيوم في حالة التشيعي بأشعة كاما وجسيمات ألفا (نفس الجرعة الإشعاعية وبجرع إشعاعية مختلفة).

كذلك تم دراسة معامل الامتصاص الخطي لرقائق الألمنيوم في حالة التشيعي بكاما وalfa (نفس الجرعة الإشعاعية وبجرع إشعاعية مختلفة).

أظهرت النتائج : أن معدل الشدة النافذة لرقائق الألمنيوم المشععة بالفا أكبر منه لرقائق المشععة بكاما و في حالة عدم التشيعي (نفس الجرعة الإشعاعية Dose=7.4 rad)، وان معامل الامتصاص الخطي لرقائق الألمنيوم في حالة عدم التشيعي أكبر منه في حالة التشيعي بكاما وalfa، وانه في حالة التشيعي بكاما أكبر منه في حالة التشيعي بالفا.

أما بالنسبة للجرع الإشعاعية المختلفة نتيجة اختلاف الفترات الزمنية للتعرض لرقائق الألمنيوم للإشعاع فقد أظهرت النتائج : أن الشدة النافذة لرقائق الألمنيوم المشع بكاما (3700 mrad) اكبر منه في حالة التشيعي بجسيمات ألفا (760 mrad) ، وفترات تعرض للإشعاع (1,2,3,4,5)days.

كذلك درست علاقة معامل الامتصاص الخطي مع زيادة الفترات الزمنية للتعرض للإشعاع وكانت علاقة تناقصية ، وأن معامل الامتصاص الخطي لرقائق الألمنيوم المشع بالفا (760 mrad) أكبر منه في حالة التشيعي بكاما (3700 mrad) ولجميع فترات التعرض للإشعاع .

الجانب النظري

تمتاز الإشعاعات المؤينة بقدرتها على تأين أو تهيج ذرات المادة التي تتفاعل معها، وت تكون من مجموعتين: المجموعة الذرية وتشمل الأشعة فوق البنفسجية ، الأشعة السينية، والالكترونات، والمجموعة الثانية فتضم الإشعاعات التي تتطلق من النواة وهي جسيمات ألفا، بيتا، وفوتونات كما [1] .

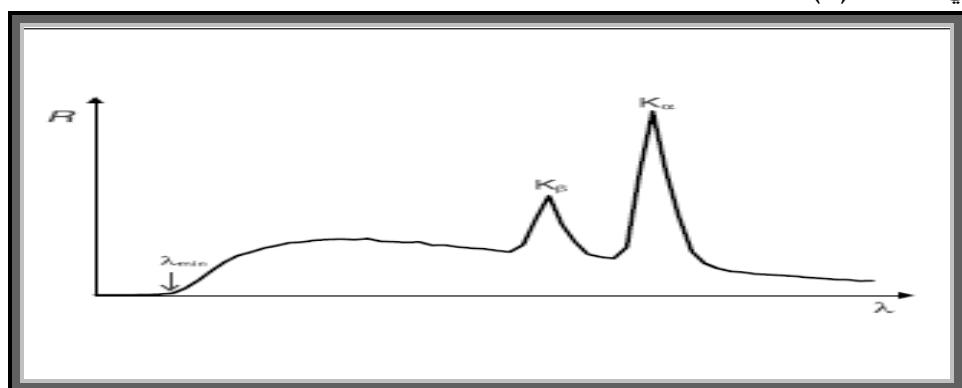
تستخدم وحدة الراد (Radiation Absorbed Dose rad) (جرعة الإشعاع الممتص) لقياس الطاقة الممتصة من المادة بالتشعيع الخارجي باستخدام أشعة كاما أو الجسيمات المشحونة (كجسيمية ألفا) [٢].

$$1 \text{ rad} = 10^6 \text{ dis/sec} \dots\dots\dots(1)$$

وان الجرعة الإشعاعية الكلية التي يتلقاها الجسم تمثل معدل الجرعة مضروباً بزمن التعرض، وهكذا أن زيادة التعرض تعني زيادة كمية الجرعة الممتصة [٣].

تعتمد تقنية الأشعة السينية على تصادم الكترونات ذات طاقة عالية مع مادة الهدف، فعند توقفها أو تباطئها بمادة الهدف يصبح الهدف مصدراً للأشعة السينية.

و عند قياس شدة الأشعة السينية المنبعثة عن هدف (النحاس مثلاً) كدالة لطول موجتها بواسطة مطياف بلوري وجد أن الطيف الناتج يتتألف من نوعين متميزين هما: طيف مستمر line Spectrum و طيف خطي continuous Spectrum مبين في الشكل (1) [٤].



الشكل (1): الطيف المستمر والطيف الخطي الحاد للأشعة السينية

الطيف الخطي ينتج بسبب الإشعاع الناجم عن إعادة ترتيب الإلكترونات المدارية لذرات مادة الهدف في مستويات الطاقة المختلفة، وتعطى هذه الأشعة المميزة الحروف K,L,M,,N طبقاً للغلاف الخارجي المنزوع منه الإلكترونات ، و بديهي أن ينتمي الشعاع K إلى أعلى طاقة واقصر طول موجة ثم يليه L وهكذا حيث أن طرد الكترون من الغلاف K يتبعه سقوط الكترون من الغلاف L إلى الغلاف K لتعويض النقص والوصول بالذرة إلى حالة أكثر استقراراً وينتج عن هذه الحالة انبثاث الخط K_α . أما إذا كان التعويض من الغلاف M إلى الغلاف K فينتج عن هذه الحالة انبثاث الخط K_β [٥].

ويتوقف ازدياد شدة الخطوط على شدة التيار المار بين الكاثود والأنود عن الحد الحراري (حد ظهور الطيف الخطي) ، ويمكن كتابة العلاقة للأشعة المميزة للخط K :

$$I_{K-line} = B.I.(V - V_K)^n \dots\dots\dots(2)$$

حيث يمثل B ثابت ، V جهد الأنود، V_K الجهد الحرج للأشعة المميزة K ، I التيار المار في أنبوبة الأشعة ، n ثابت يقدر بنحو 1.5 و هذه الأشعة وخاصة α تلعب دوراً هاماً في دراسة البنية البلورية للمواد الصلبة [6] .

عند سقوط حزمة من الأشعة السينية أو أشعة كاما على شريحة رقيقة من مادة ماصة ، فإن كل فوتون مزاح من الحزمة يزاح بشكل منفرد وبهذا تضعف شدة الحزمة الساقطة ، وبذلك تكون شدة الأشعة النافذة I أقل من شدة الأشعة الساقطة I_0 على المادة، ويتوقف مقدار النقص الحاصل في شدة الأشعة (dI) بعد قطعها سمكاً (dx) على السمك (x) و شدة الأشعة الساقطة I_0 أي أن [7]:

و عند تكامل المعادلة وأخذ اللوغاريتم الطبيعي للطرفين:

$$\int dI/I_0 = \int -\mu dx \dots \dots \dots (4)$$

حيث يمثل μ ثابت التناسب ويسمى معامل الامتصاص الخطى (Coefficient of Linear Absorption).

عموماً إن معامل الامتصاص الخطى μ لأشعة كاما والأشعة السينية يمثل مجموع عدة ظواهر أهمها حدوث الظاهرة الكهروضوئية (Photoelectric)، واستارة كومتن . [8] κ (Pair Production) (Compton)

أما بالنسبة لجسيمة ألفا فعند مرورها خلال وسط ما فإنها تتفاعل بشكل رئيسي مع الكترونات ذلك الوسط نتيجة لقوة كولوم التي تؤثر بين الجسيمة المشحونة والاكترونات، لذلك فإن الآلية المهيمنة على فقدان طاقة ألفا هي الاستطارة الكولومية مما يؤدي إلى تأينتها أو أثارتها [9].

كذلك أن معامل الامتصاص الخطي يزداد بزيادة الطول الموجي (يتاسب طردياً مع λ^3) ولكن عند أطوال موجية حرجية معينة ينخفض معامل الامتصاص وهذا الانخفاض سببه أنه بزيادة الأطوال الموجية فإن طاقة فوتون الأشعة السينية تكون قليلة لاتكفي لطرد إلكترون من القشرة ويزداد الطول الموجي فأن معامل الامتصاص يزداد [10].

رائق الألمنيوم المستخدم في حفظ الاغذية قيد الدراسة يتكون من ٩٨٪ من الألمنيوم الطبيعي و ٢٪ من معادن (منغنيز، زنك، قصدير، خارصين)، لونه أبيض - فضي، العدد الذري له $Z=13$ ، الوزن الجزيئي 26.98 ، وكتافته 2.7 gm/cm^3 [11].

الهدف من البحث

دراسة تأثير الإشعاعات المؤينة (γ -rays, α -rays) على رقائق الألمنيوم المستخدم في حفظ الأغذية بتقنية الأشعة السينية من خلال دراسة:

- معدل الشدة النافذة لرقائق الألمنيوم في حالة التشيع بأشعة كاما وجسيمات ألفا (النفس الجرعة الإشعاعية) ومقارنتها مع الشدة الساقطة والشدة النافذة في حالة عدم التشيع مع رسم المخطط البياني الذي يوضح ذلك.
- معامل الامتصاص الخطى لرقائق الألمنيوم في حالة التشيع بكاما والفا (النفس الجرعة الإشعاعية) ومقارنتها مع معامل الامتصاص الخطى للرقائق في حالة عدم التشيع مع رسم المخطط البياني الذي يوضح ذلك .
- معدل الشدة النافذة ومعامل الامتصاص الخطى لرقائق الألمنيوم في حالة التشيع بأشعة كاما وجسيمات ألفا لفترات تعرض للإشعاع مختلفة.
- رسم العلاقات البيانية بين معامل الامتصاص الخطى لرقائق الألمنيوم المشععة بكاما وألفا كدالة لفترات التعرض للإشعاع.

الجانب العملي..... الأجهزة المستخدمة

أولاً: جهاز وحدة الأشعة السينية (35KV) تم تجهيزه من قبل شركة PHYWE الألمانية .

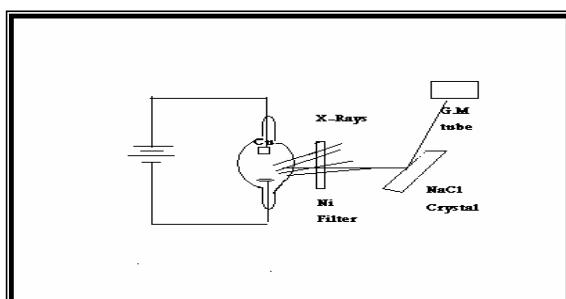
ثانياً : الجونيوميتير : الجهاز المستخدم في هذه الدراسة من صنع شركة PHYWE الألمانية.

ثالثاً: المسدد : المستخدم في هذه الدراسة من نوع Ni ذات قطر (0.05mm) رابعاً : عداد كايكر - مولر.

خامساً: أنبوبة الأشعة السينية : الأنبوبة المستخدمة في هذه الدراسة أنبوبة النحاس Cu-tube صنع شركة PHYWE الألمانية.

سادساً: بلورة كلوريد الصوديوم NaCl

سابعاً: مصدر لأشعة كاما السيلزيوم (Cs-137) ، ومصدر لجسيمات ألفا الامريلسيوم (Am-241) وترتبط الدائرة الكهربائية كما موضح بالشكل (2).



الشكل(2): الدائرة الكهربائية للأشعة السينية

طريقة العمل

بعد أعداد وتهيئة عدد من رقائق الألمنيوم ذي السمك 0.017mm ، تم تشيع أحد هذه الرقائق بأشعة كما Gamma rays (Cs-137) بفاعلية إشعاعية مقدارها (Activity) لمرة 20 ساعة، فيما شاعت الرقيقة الأخرى بجسيمات ألفا (Alpha particles) لمرة $=370\text{kBq}$ (Am-241) بفاعلية إشعاعية مقدارها (Activity = 76kBq) لمرة 97.5 ساعة تقريباً لتصل إلى نفس الجرعة الإشعاعية (Dose= 7.4 rad) لرقيقة الألمنيوم المشععة بأشعة كما [12]. كذلك تم تشيع رقائق أخرى بأشعة كما وجسيمات ألفا وبفترات زمنية وبجرع إشعاعية مختلفة.

بعد تهيئة منظومة الكشف والقياس الخاصة بوحدة x-ray unit. وضعت بلورة كلوريد الصوديوم الأحادية (111) NaCl على محرك الجيومينيتر الخاص بها. وثبتت قيمة الزمن Gate Time= 5sec ، وفولتية الانود $\text{H.V.}=35\text{KV}$ وتيار الانود $I=1\text{mA}$. دور المحرك بحيث تكون زوايا دوران الكاشف ضعف زوايا دوران البلورة وابتدأ من 0° إلى 60° وبخطوات منتظمة مقدارها 0.1° .

تم قياس شدة الأشعة السينية الساقطة (I_0) كدالة لزاوية التشتت θ ، ويعين قيمة الذروتين ($K_B=23.4$ ، $K_\alpha=26.4$) في الرتبة $n=1$ (مرتبة الحيد). ثم توضع أحد رقائق الألمنيوم على حاملة السلايدات وثبتت ذراع العداد عند الزاوية التي يقع فيها الخطين K_B ، K_α لإيجاد معدل الأشعة النافدة (I) من رقائق الألمنيوم باستخدام تقنية X-rays وتحكر الخطوات السابقة لإيجاد معدل الأشعة النافدة لرقائق الألمنيوم المشع بأشعة كما I_γ وبجسيمات ألفا I_α التي لها نفس الجرعة الإشعاعية.

تحكر الخطوات السابقة على الرقائق المشععة بكاما وألفا بفترات تعرض للإشعاع مختلفة (1,2,3,4,5)days للحظة تأثير زيادة الفترات الزمنية للتعرض على معدل الشدة لرقائق الألمنيوم المشع وكذلك الجرع الإشعاعية المختلفة على معامل الامتصاص الخطى .

النتائج والمناقشة

من تطبيق قانون براك تم إيجاد الطول الموجي المقابل للخطين $\lambda_{K\beta}$ ، $\lambda_{K\alpha}$ [4] .

$$2ds\sin\theta = n\lambda \quad \dots \dots \dots \quad (9) \quad (\text{قانون براك})$$

$$n \lambda_{KB} = 2(2.814) \sin(11.7^\circ) , \quad n \lambda_{K\alpha} = 2(2.814) \sin(13.2^\circ) \\ = 1.141 \text{ A}^\circ , \quad = 1.285 \text{ A}^\circ$$

حيث ان $d=2.814\text{A}^\circ$ يمثل يمثل المسافات البينية لبلورة كلوريد الصوديوم (NaCl) ، و θ زوايا التشتت المقابلة للذروتين ($K\alpha=26.4^\circ$ ، $K_B=23.4^\circ$ ، $n=1$ (مرتبة الحيد)).

وجد أن $\lambda_{K\alpha} = 1.285 \text{ A}^\circ$ و $\lambda_{KB} = 1.141 \text{ A}^\circ$ والجدول (1) يبين قيم زوايا التشتت θ 2

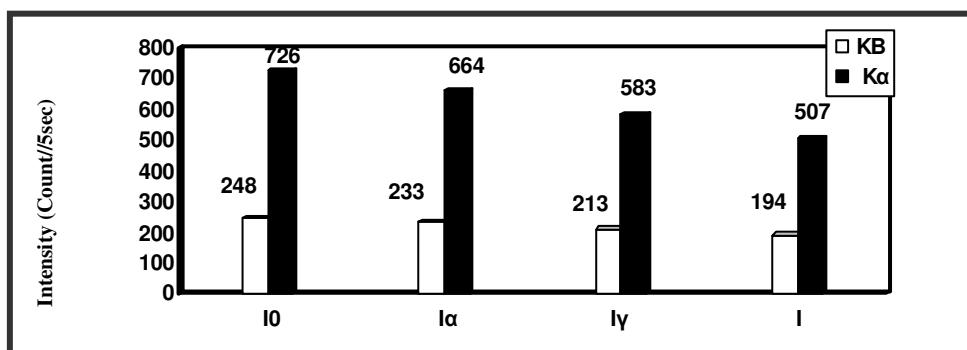


المقابلة للذروتين K_B , K_α ، ومعدل شدة الأشعة الساقطة I_0 ، والأشعة النافذة لرقيقة الألمنيوم I ، والأشعة النافذة لرقيقة الألمنيوم المشععة بأشعة كاما γ ، ومعدل شدة الأشعة النافذة لرقيقة الألمنيوم المشععة بجسيمات ألفا I_α لنفس الجرعة الإشعاعية (7.4 rad).

جدول (١): زوايا التشتت 2θ المقابلة للخطين K_B , K_α ، ومعدل شدة الأشعة الابتدائية الساقطة لرقائق الألمنيوم I_0 ، ومعدل الشدة النافذة لرقائق الألمنيوم (بدون تشيع) I ، ومعدل الشدة النافذة لرقائق الألمنيوم المشععة بأشعة كاما γ ، ومعدل الشدة النافذة لرقائق الألمنيوم المشععة بجسيمات ألفا I_α لنفس الجرعة الإشعاعية (Dose=7.4 rad)

	2θ	I_0	I	I_γ	I_α
K_B	23.4	248	194	213	223
K_α	26.4	726	507	583	664

ثم رُسما التخطيط البياني التي يوضح معدل الشدة (Intensity count/5sec) المقابلة للخطين K_B , K_α للأشعة الساقطة I_0 ، بوجود رقيقة الألمنيوم I (بدون تشيع) ، وفي حالة تشعيتها بكماء γ وألفا I_α على التوالي كما في الشكل (٣).



شكل (٣): معدل الشدة كدالة للشدة الساقطة I_0 ، النافذة للألمنيوم I (غير المشع) ، النافذة للألمنيوم المشع بالفأ I_α ، النافذة للألمنيوم المشع بكماء γ و المقابلة للذروتين K_γ , K_B .

نلاحظ من الشكل (٣) أن معدل الشدة لرقائق الألمنيوم المشع أكبر منه في حالة عدم التشيع، وذلك لأن للإشعاع المؤين تأثيرات كيمائية وفiziائية على المادة التي يسقط عليها منها : كسر الأوامر الكيمائية وزيادة المسافات البينية ونقصان في الكثافة مما يؤدي إلى عيوب في التركيب البلوري للمادة وبالتالي زيادة شدة الأشعة النافذة لرقائق المشععة[13]. كذلك أن معدل الشدة النافذة لرقائق الألمنيوم المشع بالفأ I_α كان أكبر منه في حالة التشيع بكماء γ أو للذروتين K_B , K_α (نفس الجرعة الإشعاعية 7.4 rad) ، وذلك لأن تأثير الإشعاع على المادة يمثل معدل الطاقة الخطية المنتقلة (Linear Energy Transfer) keV التي تتناسب طردياً مع مربع الشحنة للجسيمة و عكسياً مع مربع السرعة وبذلك فإن تأثير جسيمة ألفا(نواة

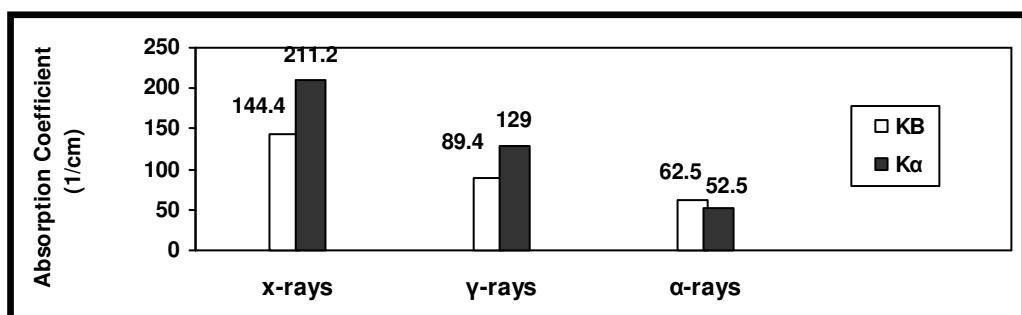
ذرة الهليوم) كبير جداً وأكثر من تأثير كما (أشعة كهرومغناطيسية متعادلة الشحنة وسريعة) على الألمنيوم [14].

أيضا تم إيجاد معامل الامتصاص الخطى (Linear Absorption Coefficient) بتطبيق المعادلة (7) ، والجدول (2) يبين معامل الامتصاص الخطى (μcm^{-1}) المقابلين للذروتين K_B ، K_α ، بتقنية الأشعة السينية لرقيقة الألمنيوم $\text{cm}^{-1} \mu$ ، ومعامل الامتصاص الخطى لرقيقة الألمنيوم المشع بكاما $\text{cm}^{-1} \mu_\gamma$ وبجسيمات ألفا $\text{cm}^{-1} \mu_\alpha$.

جدول(2): معامل الامتصاص الخطى (μcm^{-1}) للخطين K_B , K_α لرقيقة الألمنيوم المشع بكاما والالفا .

	μcm^{-1}	$\mu_\gamma \text{cm}^{-1}$	$\mu_\alpha \text{cm}^{-1}$
K_B	144.4	89.4	62.5
K_α	211.2	129.0	52.5

والخطيط البياني الشكل (٤) يبين معامل الامتصاص الخطى لرقيقة الألمنيوم المقابلين للذروتين K_α , K_B ، لنفس الجرعة الإشعاعية (بتقنية الأشعة السينية $\text{cm}^{-1} \mu_x$ - بدون تشيع)، واسعة كما $\text{cm}^{-1} \mu_\gamma$ وجسيمات ألفا $\text{cm}^{-1} \mu_\alpha$.



شكل(4): معامل الامتصاص الخطى ($\text{cm}^{-1} \mu$) كدالة للإشعاع المؤين (γ rays, α -rays) لنفس الجرعة الإشعاعية والمقابلة للذروتين K_α , K_B .

يوضح الشكل (٤) أن معامل الامتصاص الخطى لرائق الألمنيوم المشع بكاما $\text{cm}^{-1} \mu_\gamma$ والمقابل للذروتين K_α , K_B أقل منه في حالة عدم التشيع $\text{cm}^{-1} \mu$ ، وكذلك الحال بالنسبة لمعامل الامتصاص لرائق الألمنيوم المشع بـألفا $\text{cm}^{-1} \mu_\alpha$ كان أقل منه في حالة التشيع بكاما $\text{cm}^{-1} \mu_\gamma$ وفي حالة عدم التشيع $\text{cm}^{-1} \mu$ (نفس الجرعة الإشعاعية ، وذلك لأن معامل الامتصاص الخطى μ يتاسب مع المشعة ($\ln \frac{I}{I_0}$) بثبوت السمك ($X=0.0017 \text{ cm}$))

معادلة (٧)، وبما أن الشدة لرقائق الألمنيوم المشععة بـ α كانت أكبر منها في حالة التشيع بكاما وفي حالة عدم التشيع ، لذلك كان $\mu_{\alpha} > \mu_{\gamma}$.

وتم كذلك قياس معدل الشدة النافذة لرقائق الألمنيوم المشععة بأشعة كاما وجسيمات ألفا بفترات تعرض للإشعاع مختلفة . والجدول (٣) يبين قيم زوايا التشتت θ المقابلة للخطين K_B ، ومعدل شدة الأشعة النافذة لرقائق الألمنيوم المشععة بأشعة كاما I_{γ} ، والمشععة بجسيمات ألفا I_{α} ، وبفترات تعرض للإشعاع مختلفة day (١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥).

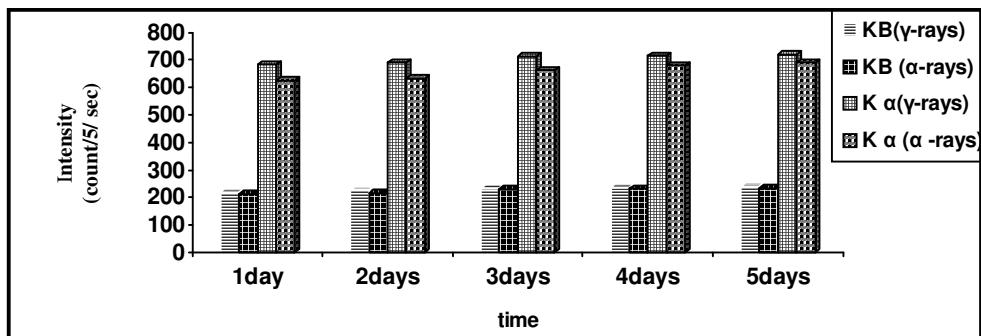
جدول (٣) : معدل الشدة لرقائق الألمنيوم المشععة بكاما (3700 m rad) وألفا (760 rad)

المقابلة للذروتين K_B , K_{α} وبفترات زمنية (1,2,3,4,5) days

	(1) day		(2) day		(3) day		(4) day		(5) day	
	I_{γ}	I_{α}								
K_B	220	212	228	216	234	230	236	232	240	233
K_{γ}	683	625	689	632	712	662	714	679	720	690

و رُسما المخطط البياني الذي يوضح معدل الشدة النافذة المقابلة للخطين K_B , K_{α} كدالة لفترات التعرض المختلفة لأنشعة كاما (3700m rad) وجسيمات ألفا (760 m rad) .

الشكل (٥).



شكل (٥): معدل الشدة النافذة كدالة للتعرض (لأنشعة كاما 3700m rad وألفا 760 m rad)

بفترات تعرض للإشعاع مختلفة والمقابلة للذروتين K_B , K_{α} ،

نلاحظ من الشكل (٥) معدل الشدة النافذة لرقائق الألمنيوم المشع بـ α وـ γ (I $_{\alpha}$, I $_{\gamma}$) المقابلة للذروتين (K $_{\alpha}$, K B) تزداد مع زيادة فترات التعرض للإشعاع ، وذلك لأن الجرعة الإشعاعية الكلية التي تتلقاها المادة تمثل حاصل ضرب الجرعة في زمن التعرض وهذا أن زيادة فترة التعرض للإشعاع تعني زيادة كمية الجرعة المتتصة [15]. وكذلك معدل الشدة النافذة لرقائق الألمنيوم المشع بـ α (3700 m rad) كان أكبر من معدل الشدة النافذة لرقائق الألمنيوم

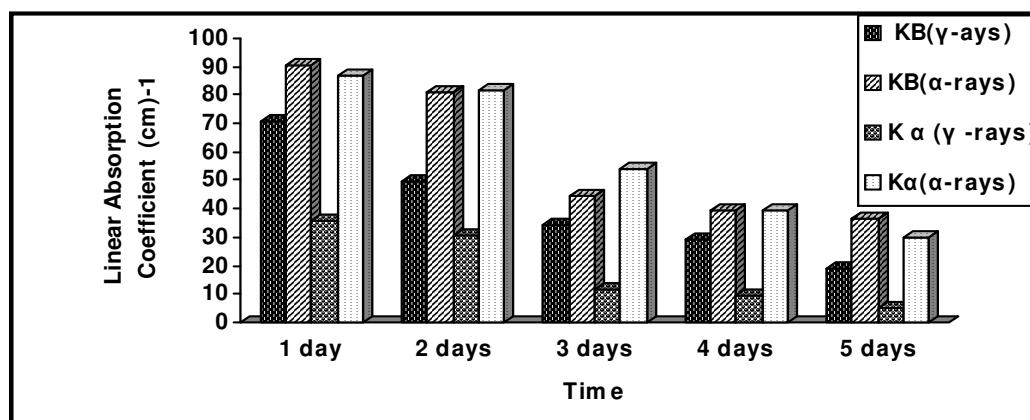
المشع بجسيمات ألفا (760 m rad) ولجميع فترات التعرض للإشعاع وذلك لأن الجرعة الممتصصة أكبر.

تم كذلك إيجاد معامل الامتصاص الخطى ($\mu \text{ cm}^{-1}$) لرقائق الألمنيوم المشع بكاما μ (3700 m rad) والفا μ_α (760 m rad) ، والجدول (٤) يبين معامل الامتصاص الخطى ($\mu \text{ cm}^{-1}$) المقابلين للخطين K_B , K_α ، لرقائق الألمنيوم المشع بكاما μ والفا μ_α وبفترات تعرض للإشعاع مختلفة.

جدول (٤) : معامل الامتصاص الخطى ($\mu \text{ cm}^{-1}$) لرقائق الألمنيوم المشع بكاما (3700 m rad) والفا μ_α (760 m rad) المقابلة للذروتين K_B , K_α وبفترات تعرض days (١,٢,٣,٤,٥)

	(1) day		(2) day		(3) day		(4) day		(5) day	
	$\mu\gamma$ (cm) ⁻¹	$\mu\alpha$ (cm) ⁻¹								
K_B	70.47	90.26	49.46	81.26	34.18	44.32	29.17	39.23	19.28	36.7
K_γ	35.91	87.17	30.76	81.56	11.45	54.28	9.8	39.36	4.88	29.91

والخطيط البياني الشكل (٦) يبين معامل الامتصاص الخطى لرقائق الألمنيوم المقابلين للذروتين K_B , K_α والمشع بكاما (3700 m rad) والفا (760 m rad) وبفترات تعرض زمنية مختلفة.



وبفترات تعرض للإشعاع مختلفة.

شكل (٦) : معامل الامتصاص الخطى ($\mu \text{ cm}^{-1}$) كدالة للتعرض (كاما) (3700 m rad) وألفا (760 m rad) وبفترات زمنية مختلفة والمقابلة للذروتين K_B , K_α يوضح الشكل (٦) أن معامل الامتصاص الخطى لرقائق الألمنيوم المشع بكاما (3700 m rad) والمشع بالفا (760 m rad) المقابل للذروتين K_B , K_α يقل مع زيادة فترات التعرض للإشعاع، وأن معامل الامتصاص الخطى لرقائق الألمنيوم المشع بالفا

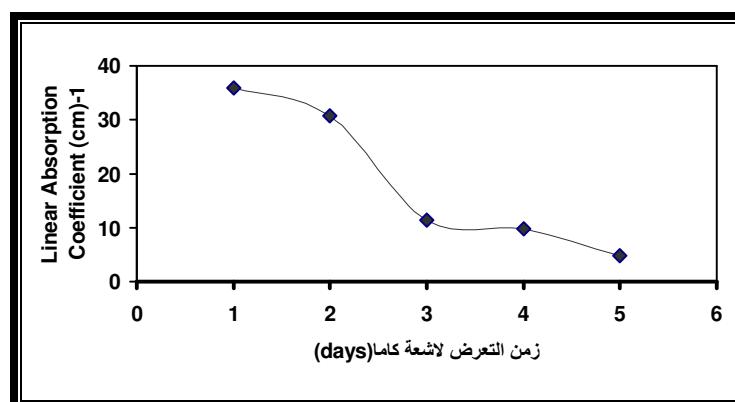
كما كان أكبر منه بالنسبة لرقائق الألمنيوم المشعع بكماء $\mu_{\gamma} \text{ cm}^{-1}$ ، وذلك لأن معامل الامتصاص الخطى μ يتتناسب مع (المشععة $I/\ln(I)$) بثبوت السمك، وبما أن الشدة لرقائق الألمنيوم المشععة بكماء كانت أكبر منها في حالة الشعيع بـ α ، وذلك لأن الجرعة الممتصة أكبر لذلك كان $\mu_{\gamma} > \mu_{\alpha}$.

والجدول (٥) تأثير زيادة زمن التعرض (days) لأشعة كاما (جرعة أشعاعية 3700 m rad) وجسيمات ألفا (جرعة أشعاعية 760 mrad) على معامل الامتصاص الخطى لرقائق الألمنيوم والمقابل للذروة K_{γ} .

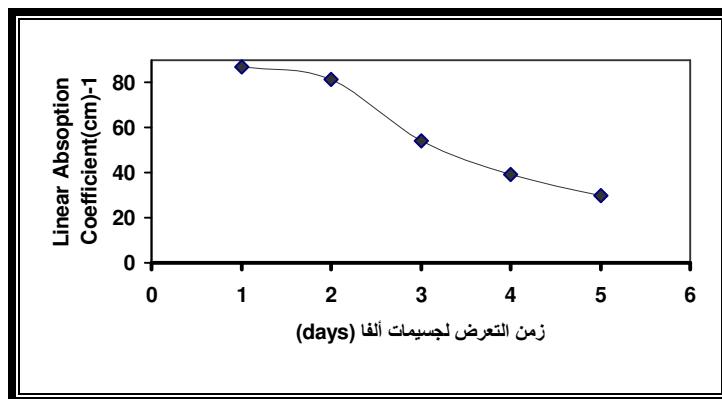
جدول (٥) : زمن التعرض (days) لأشعة كاما (جرعة أشعاعية 3700 m rad) وجسيمات ألفا (جرعة أشعاعية 760 m rad) على معامل الامتصاص الخطى لرقائق الألمنيوم والمقابل K_{γ} .

$\mu_{\alpha}(\text{cm})^{-1}$ 760 mrad	$\mu_{\gamma} (\text{cm})^{-1}$ 3700 mrad	زمن التعرض (days)
87.17	35.918	١
81.51	30.76	٢
54.28	11.45	٣
39.36	9.8	٤
29.91	4.8	٥

والإشكال البيانية (٧) يبين العلاقة البيانية لمعامل الامتصاص الخطى $\mu_{\gamma} \text{ cm}^{-1}$ لرقائق الألمنيوم المشععة بكماء (جرعة إشعاعية 3700 m rad) و بالفأ (جرعة إشعاعية 760 m rad) كدالة لزمن تعرض الرقائق للإشعاع (rad).



الشكل (٧) : معامل الامتصاص الخطى $\mu_{\gamma} \text{ cm}^{-1}$ لرقائق الألمنيوم المشععة بكماء (جرعة إشعاعية 3700 mrad) كدالة لزمن التعرض للإشعاع (days).



الشكل (٨) : معامل الامتصاص الخطى $\mu\gamma \text{ cm}^{-1}$ لرقائق الألمنيوم المشععة بالآلفا (بجرعة أشعاعية 760 mrad) كدالة لزمن التعرض للإشعاع (days).

نلاحظ من الأشكال (٧) و (٨) أنه بزيادة فترات تعرض رقائق الألمنيوم للإشعاع فإن معامل الامتصاص الخطى لها يقل ، وذلك لأنه بزيادة فترات التعرض فإن الجرعة الممتصة الكلية للألمنيوم تزداد وبالتالي تزداد العيوب الذى يخلفها الإشعاع على المعدن ، مما يؤدى إلى زيادة الشدة النافذة وبالتالي زيادة معامل الامتصاص الخطى .

Implementation of x-rays method to Study the Effect of Ionic Rays on storage Nutrient Aluminum foil.

Asmaa Ahmad Aziz

Physics department / College of Education/University of Tikrit/ Tikrit/Iraq

Abstract

We study the effect of Ionic rays (Alpha particle and Gamma ray) on Aluminum foils which use in storage of nutrient materials by method of X-rays through study the mean of emergent Intensity from Aluminum foil Irradiation with γ -rays and α -particle (at same radiological doses and different doses).

Also we study the Linear Absorption Coefficient of Aluminum foil irradiation with γ -rays and α -particle (same and different doses).

Results as appeared: the mean of emergent Intensity from Aluminum foil irradiation with α -particle bigger than mean of emergent intensity from Aluminum foil irradiation with γ -rays and in stage which irradiated (at same dose 7.4 rad). But according for different radiological doses which result from different period time for exposure of Aluminum foil to radiation result as shown: the emergent Intensity from Aluminum foil irradiation with γ -rays(dose 3700mrad)bigger than in radiation with α -particle(dose 760mrad), for time period exposure (1,2,3,4,5)days.

Also study relation linear absorption coefficient by increase the time period exposure to radiation ,results that appeared is in reduction side.

Linear absorption coefficient for Aluminum foil irradiation with α -particle(dose 760mrad) bigger than γ -rays(dose 3700mrad) for all time exposure.

المصادر

1. William.J.P., Nuclear Radiation Detection : United State of America. Me Grow-Hill-(1965).
2. Ionizing Radiation and health,URL:http://www.Arpansa.gov.au/is_rad.htm,2003.
3. Material Research Society; Keyst Drive, Warrendale, PA, 15086-7573, USA, 2007.
4. منيب عادل خليل ، الفيزياء النووية: الفصل الثاني ص—١٢٢ ، دار الكتب للطباعة والنشر-الموصل(١٩٩٦)
5. . يحيى نوري الجمال، فيزياء الحالة الصلبة: طبعة ثانية: الفصل الرابع ص—١٢١، دار الكتب والوثائق ببغداد(2000) .
6. طالب ناهي الخفاجي، عباس حمادي، هرمز موشي، الفيزياء الذرية (الجزء الأول): الفصل الرابع ص—١٨٣، مطبع جامعة بغداد – (1980).
7. خالد عبيد الأحمد، مقدمة في الفيزياء الصحية : الفصل الثاني ص—٨٧، طبعت بدار الكتب للطباعة والنشر-جامعة الموصل-(1993).
8. Littlefield.T.A. and Chorley.D.Van, Atomic and Nuclear Physics, Nostrand Company Ltd Toronto- (1968).
9. Willmott. J.C., and Arrowsmith. J.W. , Atomic Physics Ltd (1978).
- 10.Agecy for Toxic substances and Disease Registry, ToxFAQsTM for Aluminum, 2006.
- 11.Atomic and Nuclear Physics, Leybold Didold Didactic Gmbtt, Printed in the Federal Republic of Germany (2006).
- 12.<http://www.ph.utexas.edu/phy>,Radiation Detection and shield, Absorption of Beta and Gamma Radiation,(2006).
- 13.Youn. H.D. and Freedman. R.A., University Physics, tenth edition: chapter 38-7 pag, (2005).
- 14.Nuclear and Space Radiation effects on materials, NASA SP-8053, 1970.
- 15.Heslop. R.B. and Jones. K.A., Inorganic Chemistry, Amsterdam-Oxford-New York, Elsevier Scientific, Publishing Company (1976).